

Практический семинар по микроскопии, спектральному анализу и механическим испытаниям

Программа семинара

г. Астана, Jumbaktas Hotel, ул. Карасакал Еримбет, 65
конференц-зал Абылайхан, этаж 3

24-25
апреля
2024

В рамках проведения семинара состоится мастер-класс на оборудовании:

Sunny Optical /Китай/

Инвертированный микроскоп Soptop ICX41M

STRUERS /Дания/

Автоматический шлифовально-полировальный
станок Tegramin-15

OLYMPUS /Япония/

Поляризационный микроскоп BX53P

EMCO-TEST /Австрия/

Микротвердомер DuraScan-20

24 апреля

г. Астана
Jumbaktas Hotel, ул. Карасакал Еримбет, 65
конференц-зал Абылайхан, этаж 3

08:30		Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
09:00	Фульман Олег Павлович	Приветственное слово от компании «Мелитэк».
09:20	Семенова Юлия Михайловна	Оптико-эмиссионные спектрометры компании Metal Power Analytical (Индия). Новинка: Спектрометр Metavision RX.
10:00	Ахметов Марат Фанильевич	Анализаторы CS/ONH компании Melytec (Китай) для измерения неорганических материалов. Расходные материалы Alpha Resources (США).
10:30	Фульман Олег Павлович	Обзор портативных рентгенофлуоресцентных спектрометров из Китая. Новинка: Портативные спектрометры от компании JPspec (Китай). Рентгенофлуоресцентные спектрометры для микроанализа компании Aczet (Индия).
11:10		Кофе-брейк
11:30	Головков Анатолий Викторович	Рентгенофлуоресцентные спектрометры компании Xenometrix (Израиль). Новинка: Спектрометр волнодисперсионного типа Melytec WD4000. Пробоподготовка для рентгенофлуоресцентного анализа.
12:10	Ахметов Марат Фанильевич	Рентгеновские дифрактометры компании Tongda (Китай). Новинка: Дифрактометрические приставки для расширения аналитических возможностей оборудования.
12:50		Доклад пользователя.
13:00		Обед.
14:00	Фульман Олег Павлович	Инновационные решения в области элементного анализа компании «Analytik Jena» (Германия).
14:40	Ахметов Марат Фанильевич	Обновления в модельном ряду ИК-Фурье и Раман-спектрометров для анализа органических веществ и полимерных материалов компании Optosky (Китай).
15:10	Фульман Олег Павлович	Системы промышленной рентгеновской томографии компании Sanying (Китай).
16:00		Ответы на вопросы. Розыгрыш приза среди заполнивших опросные листы.
16:30		Мастер-класс: «Индивидуальная работа с вашими образцами».
17:30		Завершение первого дня семинара.

25 апреля

г. Астана
Jumbaktas Hotel, ул. Карасакал Еримбет, 65
конференц-зал Абылайхан, этаж 3

08:30		Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
09:00	Синюков Александр Владимирович	Современные решения для пробоподготовки металлографических образцов Trojan (Китай), «Struers» (Дания). Новинка: Высокопроизводительный отрезной станок Beta 500, Trojan (Китай).
09:45	Синюков Александр Владимирович	Обзор оптических микроскопов «Sunny Optical» (Китай), Olympus (Япония).
10:30	Ханин Виталий Александрович	Настольные сканирующие электронные микроскопы Zeptools (Китай). Новинка: Микроскоп последнего поколения ZEM 20.
11:00		Перерыв. Кофе-брейк.
11:15	Ханин Виталий Александрович	Электронные микроскопы Melytec (Китай). Обзор актуальных и перспективных моделей.
11:40	Долгих Александр Евгеньевич	Комплексные решения для определения механических свойств поверхностей Nanovea (США).
12:10	Синюков Александр Владимирович	Твердомеры Sinowon (Китай), Emco-Test (Австрия). Обзор модельного ряда. Новинка: Твердомеры серии DigiRock Sinowon (Китай).
12:50		Доклад пользователя.
13:00		Обед.
14:00	Долгих Александр Евгеньевич	Универсальные испытательные машины «Мелитэк» (Россия). Новинка: Цифровая высокоскоростная система управления ЦК-8, ПО ЛАБ7.
14:40	Долгих Александр Евгеньевич	Магнитно-резонансные пульсаторы компании «Мелитэк» (Россия) для высокочастотных испытаний на усталость, выращивания трещин и определения K1C.
15:20	Ахметов Марат Фанильевич	Реометры и анализаторы текстуры компании Baosheng (Китай). Термоанализаторы Jing Yi Gao Ke (Китай) и анализаторы теплопроводности Zhenhua Analysis Instrument (Китай).
16:00		Ответы на вопросы. Розыгрыш приза среди заполнивших опросные листы.
16:10		Мастер-класс: «Индивидуальная работа с вашими образцами».
17:10		Завершение семинара.
